

# DIN CEN/TS 15605:2008-02 (D)

## Kupfer und Kupferlegierungen - Optische Emissionsspektrometrie mit induktiv gekoppelter Plasmaanregung; Deutsche Fassung CEN/TS 15605:2007

---

Inhalt	Seite
Vorwort .....	3
1 Anwendungsbereich .....	4
2 Normative Verweisungen .....	6
3 Kurzbeschreibung .....	7
4 Reagenzien und Stoffe .....	7
5 Gerät .....	12
5.1 Übliche Laboratoriumsausstattung .....	12
6 Probenahme .....	12
7 Durchführung .....	12
7.1 Verfahren A: Kupfer .....	12
7.2 Verfahren B: Kupfer-Zink-Legierungen .....	16
7.3 Verfahren C: Kupfer-Zinn-Legierungen .....	20
7.4 Verfahren D: Kupfer-Aluminium-Legierungen .....	24
7.5 Verfahren E: Kupfer-Beryllium-Legierungen .....	28
7.6 Verfahren F: Kupfer-Nickel-Legierungen .....	32
7.7 Verfahren G: Kupfer-Blei-Zinn-Legierung .....	36
8 Angabe der Ergebnisse .....	40
9 Präzision .....	41
9.1 Verfahren B — Kupfer-Zink-Legierungen .....	41
9.2 Verfahren C — Kupfer-Zinn-Legierungen .....	42
9.3 Verfahren D — Kupfer-Aluminium Legierungen .....	43
9.4 Verfahren F — Kupfer-Nickel-Legierungen .....	44
9.5 Verfahren G — Kupfer-Blei-Zinn-Legierung .....	44
10 Prüfbericht .....	44
Anhang A (informativ) Optisches Emissionsspektrometer (OES) — Zur Überprüfung vorgeschlagene Leistungskriterien .....	45
Literaturhinweise .....	47